ДЛИННОВОЛНОВЫЕ НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ СВЕТОДИОДЫ НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ  $JnAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ 

Н.П. Есина, Н.В. Зотова, Б.А. Матвеев, Н.М. Стусь, Г.Н. Талалакин, Т.Д. Абишев

Твердые растворы в системе  $J_n As - J_n Sb$  являются перспективными материалами для полупроводниковой оптоэлектронии. Светодноды, изготовленные на основе этого материала, **"**охватывают спектральный ИК-диапазон (3.5-12 мкм), совпадающий с областью оптического поглощения многих промышленных газов, и могут найти широкое применение в газоанализаторах.

В опубликованных ранее работах [1, 2] сообщалось, что для тройных твердых растворов ( x \leq 0.3) р-типа следует ожидать невысоких значений внешнего квантового выхода люминесценции, что экспериментально наблюдалось при исследовании электролюминесценции (ЭЛ)  $JnAs_{t-x}Sb_x$  р-п структур [3]. Это обусловлено тем, что в рабочей р-области излучающих структур доминирует канал безыэлучательной Оже-рекомбинации, который сопровождается передачей энергии рекомбинирующей пары второй дырке, переходящей из зоны тяжелых дырок в спинорбитально отщепленную зону [4]. Указанный процесс передачи энергии наиболее вероятен в веществах, в которых значение ширины запрещенной зоны Е $m{g}$  близко к энергии спин-орбитального отщепления  $\Delta$  . При  $\mathbf{E}_{q} = \Delta$  законы сохранения энергии и импульса не накладывают никаких ограничений на энергию рекомбинирующих частиц. Коэффициент Оже-рекомбинации в  $JnAs_{1-x}Sb_x$  возрастает с увеличением содержания сурьмы и достигает максимума при составе  $JnAs_{0.7}Sb_{0.3}$  300 К) [2]. Вместе с тем именно составы с х 20.3 представляют наибольший интерес для изготовления источников излучения.

Одним из возможных путей преодоления данного препятствия является использование четы рехкомпонентных твердых растворов  $JnAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ , в которых резонанс энергий  $E_g=\Delta$  должен быть нарушен за счет более быстрого уменьшения  $\Delta$ по сравнению с изменением Е q при увеличении содержания

В настоящей работе приводятся результаты исследования электрических и люминесцентных свойств ИК-светодиодов, изготовленных на основе твердых растворов  $J_{n}As_{j-x-y}Sb_{x}P_{y}$ , пригодных для использования в газоанализаторах при 300 К.

Светодиоды были изготовлены из р-п структур, выращенных методом жидкостной эпитаксии на подложках п-JnAs (111) В с концентрацией носителей тока (1-3)·10<sup>16</sup> см-3. Р-область создавалась путем легирования раствора-расплава цинком или

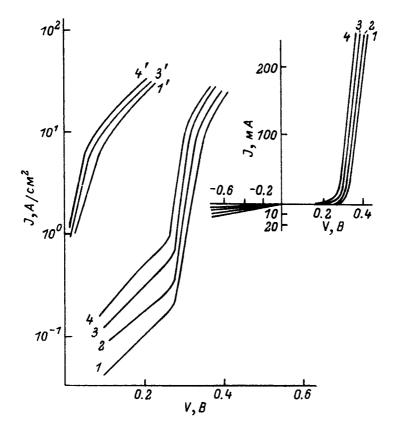


Рис. 1. Вольт-амперные характеристики светодиодов на основе твердых растворов  $J_n As_{1-x-y}Sb_xP_y$  ( $y_1>y_2>y_3>y_4$ ). (1-4) – 77 К; (1-4) – 300 К. С увеличением номера кривых уменьшается содержание фосфора.

марганцем в процессе эпитаксиального выращивания [5]. Для четверных твердых растворов в области р-п перехода содержание фосфора изменялось в пределах  $0.05 \le y \le 0.13$ , а концентрация сурьмы составляла  $\sim 0.08$ . Рассогласование периодов решеток между подложкой и слоем не превышало  $\pm 0.0071$  Å. Плотность дислокаций в лучших образцах достигала  $(5-8) \times 10^4$  см $^{-2}$ .

По энергии пика краевой фотолюминесценции (ФЛ) слоев твердых растворов определялись ширина запрешенной зоны и ее градиент по глубине эпитаксиального слоя - параметры, необходимые для локализации р-п перехода в излучающих структурах с заданной спектральной характеристикой.

Вольт-емкостные (C- V), вольт-амперные (I- V) и люмипосцентные характеристики светодиодов исследовались в интер-

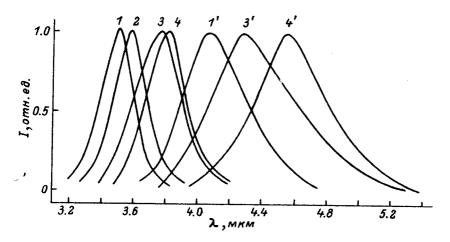


Рис. 2. Спектры электролюминесценции светодиодов на основе  $\ln As_{1-x-y}Sb_xP_y$  (1-4) – 77 K; (1'-4') – 300 K.

мале температур 77-300 К. По С- ${\it V}$  характеристикам исследуемых р-п структур было определено, что распределение примеси в слое объемного заряда близко к линейному и имеет градиент порядка  $10^{20}~_{\rm CM}$ -4.

Из удельной емкости светодиодов при нулевом смещении  $(5 \cdot 10^5 \, \frac{\text{пк}\Phi}{\text{см}^2})$  была оценена ширина слоя объемного заряда  $10^{-4}$  см. Максимальная напряженность электрического поля при нулевом смещении составляла  $5 \cdot 10^3 \, \frac{\text{В}}{\text{см}^4}$ . I-V характеристики исследуемых светодиодов при 77 и

I-V характеристики исследуемых светодиодов при 77 и 300 К представлены на рис. 1. Прямой ток  $I_{\rm np.}$  при  $eV > {}_{\rm K}{}^{\rm T}$  , кспоненциально зависит от напряжения  $I_{\rm np.} = I_{o} \exp\left(\sqrt{\beta_{\rm K}T}\right)$ 

где  $\mathcal{S}$  - безразмерный коэффициент. При низких температурах величина  $\mathcal{S}$  для исследуемых диодов была  $\sim 2$ ; эначение предэкспоненциального множителя ( $I_o$  = 10-10  $\frac{\mathcal{S}}{\mathcal{S}_{M2}}$ ) близко к

величине, рассчитанной по модели рекомбинации и генерации носителей тока в слое объемного заряда. Отношение "рекомбинационно-генерационной" компоненты тока в слое объемного заряда к "диффузионной" в р- и п-областях при 77 К достигает  $10^{10}$ . Все это свидетельствует в пользу "генерационно-рекомбинационной" модели в слое объемного заряда.

С повышением температуры ширина запрешенной зоны структур уменьшается, и отношение токов существенно меняется: так, при 300 К оно становится порядка нескольких единиц, коэффициент  $\beta$  при этом равен 1, обратные токи имеют тенденцию к насыщению. Все это свидетельствует о том, что при 300 К справедлива модель рекомбинации и генерации носителей тока в р- и п-областях.

При больших напряжениях I-V характеристики становятся линейными  $I_{\rm пр.}$  = (  $V-V_{\rm OTC.}$  ) · (  $R_{\rm OCT.}$  ) ·  $R_{\rm OCT.}$  составляет около 0.3 Ом при 77 К и 0.5 Ом при 300 К и определяется переходным сопротивлением омических контактов и толщи образца. Напряжение отсечки, определяемое контактной разностью потенциалов, увеличивается с ростом содержания фосфора в исследуемых структурах по мере увеличения ширины запрешенной зоны (рис. 1).

Спектры ЭЛ светодиодов при 77 и 300 К перекрывают диапазон волн (3-5) мкм (см. рис. 2). Спектры имеют асимметричную форму с резким спадом (  $\sim exp$  (  $\frac{hV}{kT}$  )) со стороны коротких волн и более плавным со стороны длинных. Аналогичная асимметрия наблюдалась в спектрах ФЛ для варизонных твердых растворов [6]. Полуширина спектров ЭЛ составляет 20 мэВ при 77 К и около 40 мэВ при 300 К.

Интенсивность излучения Jn As SbP -светодиодов увеличивается с ростом ширины запрещенной зоны: так, если диода № 4 ( $h \mathcal{V}_{\mathcal{M}}$  = 272 мэВ) мощность излучения при питании постоянным током  $I = 15 \frac{A}{CM^2}$  при 300 К составляет

=54 мкВт, то для образца № 3 (  $h\nu_{M}$  = 290 мэВ) W =130 мкВт; для самого коротковолнового образца № 1 ( $h \nu_{M} = 305$  мэВ) W ==200 мкВт. При этом КПД при 300 К достигает 2%. Это значение существенно выше того, которое ожидается для твердых растворов  $JnAs_{l-x}Sb_x$  с той же величиной Eq[2]. ясно преимущество системы  $JnAs_{1-x-y}Sb_xP_y$  по сравнению с  $JnAs_{1-x}Sb_x$ , связанное с нарушением резонанса  $E_g=\Delta$ .

При импульсном питании светодиодов с длительностью импульса 20 мкс и частотой 20  $\Gamma$ ц получена мощность излучения при токе в импульсе  $1000\frac{A}{cm^2}$  порядка 2-5 мВт.

Таким образом, полученные на основе  $JnAs_{4-x-u}Sb_{x}P_{u}$  длинноволновые неохлаждаемые источники излучения работают важной для практического применения спектральном диапазоне (3.5-4.6 мкм), обладают достаточно большой мощностью могут использоваться в газоаналитической аппаратуре.

## Литература

[1] O. Berolo, J.C. Woolley, J.A. Van Vechten. Phys. Rev. B, 8, 3794 (1973).

[2] Б.Л. Гельмонт, З.Н. Соколова, И.Н.Яссиевич. ФТП, 16, 592 (1982).

[3] Н.З. Жингарев, С.Г. Конников, В.Н.Корольков, Н.Н. Мурсакулов, В.В. Сазонов, Д.Н. Третьяков. П Всес. конф. по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах, тез. докл., Ашхабад (1978).

- [4] Н.В. Зотова, И.Н. Яссиевич. ФТП, 11, 1882 (1977).
- [5] Н.П. Есина, Н.В. Зотова, Б.А. Матвеев, Н.М. Стусь, Г.Н. Талалакин. Тез. докл. Ш Всес, конф, по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах, Одесса (1982).
- [6] Н.П. Есина, Н.В. Зотова, Б.А. Матвеев, Л.Д. Неуймина, Н.М. Стусь, Г.Н. Талалакин. ФТП, 15, 2362 (1981).

Физико-технический исти**тут -**им. А. Ф. Иоффе, АН СССР, Ленинград Поступило в Редакцию 2 февраля 1983 г.

Письма в ЖТФ, том 9, вып. 7 12 апреля 1983 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАНОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С МЕТАЛЛАМИ

Ю.В. Судьенков, Н.М. Филиппов, Б.Ф. Воробьев, А.И. Недбай

Исследованию механизмов взаимодействия мощного лазерного излучения с конденсированными средами уделяется значительное внимание [1-3]. Однако сопоставление результатов развиваемых теорий взаимодействия и экспериментальных исследований в широком интервале изменения интенсивностей излучения в настоящее время с трудом осуществимо (в связи разначительным разнообразием условий и методов проведения исследований).

Как известно, взаимодействие оптического излучения с конденсированными средами сопровождается генерацией акустических колебаний, амплитуда и форма которых определяется тем или иным физическим механизмом [2]. Обычно рассматриваются три процесса взаимодействия: тепловой, когда температура поверхности остается ниже температуры плавления; сопровождающийся повреждением поверхности, связанным с плавлением и испарением вещества; взрывной процесс, определяемый пробоем в парах и образованием свето-детонационной волны. Наиболее изученным и относительно простым с точки эрения теоретического описания являются тепловой и взрывной процессы [1, 3, 6]. Процессы, связанные с изменением агрегатного состояния поверхностного слоя вещества, до сих пор мало изучены и весьма сложны для теоретического описания.